

性能及び試験方法

■性能及び試験方法(チップ形EMIフィルタ)

項目		性能		試験方法および条件 (JIS C 5101-1準拠)
		CG,UJ 特性	R, X 特性	
誘電正接		2.5%以下 *性能仕様は品種ごとに異なります。詳細は個別の仕様書をご確認ください。		CG特性 : 1MHz R特性 : 1kHz 測定電圧 : 0.5~2Vrms
耐電圧		絶縁破壊および破損のないこと		直流電圧印加時間 : 1~5秒間 CG特性 : 定格電圧の300%印加 R特性 : 定格電圧の250%印加
絶縁抵抗		10,000MΩまたは500MΩ・μFのいずれか小さい方の値以上		印加電圧 : 定格電圧 印加時間 : 1分間
固着性		端子電極の剥離またはその兆候がないこと。		荷重 : 5N 保持時間 : 10秒間
耐振性	外観	著しい異常のないこと		振動周波数範囲: 10~55Hz 全振幅: 1.5mm, 10~55~10Hz 1分間 XYZ方向 各2時間 計6時間
	静電容量	規格許容差以内にあること		
	静電正接	初期規格値を満足すること		
はんだ耐熱性	外観	著しい機械的損傷がないこと		熱処理を行う。 温度: 270±5°C 浸漬時間: 10±1秒 予熱: ①80~100°C (1~2分) ②170~200°C (1~2分) 予熱を行った後、連続してはんだ浸漬を行う。
	静電容量変化率	±2.5%または±0.25pFのうち いずれか大きい方の値以下	±7.5%以下	
	Qおよび誘電正接	初期値を満足すること。		
	絶縁抵抗	初期値を満足すること。		
	耐電圧	絶縁破壊および破損のないこと。		
はんだ付け性		端子電極面が75%以上新しいはんだで覆われていること。		温度: 230±5°C 浸漬時間: 2±1秒
温度サイクル	外観	著しい機械的損傷がないこと		常温→最低使用温度→常温→最高使用温度 3分→ 30分 →3分→ 30分 上記1~4段階の温度に順次放置し1サイクルとする。 この操作を5サイクル繰り返す
	静電容量変化率	±2.5%または±0.25pFのうち いずれか大きい方の値以下	±7.5%以下	
	Qおよび誘電正接	初期値を満足すること。		
	絶縁抵抗	初期値を満足すること。		
	耐電圧	絶縁破壊および破損のないこと。		
耐湿負荷	外観	著しい機械的損傷がないこと		電圧処理を行う。 試験温度: 40±2°C 相対湿度: 90~95%RH 試験電圧: 定格電圧 試験時間: 500時間
	静電容量変化率	±5.0%または±0.5pFのうち いずれか大きい方の値以下	±12.5%以下	
	Qおよび誘電正接	5%以下		
	絶縁抵抗	1,000MΩまたは50MΩ・μFのいずれか小さい方の値以上		
高温負荷	外観	著しい機械的損傷がないこと		電圧処理を行う。 試験温度: 最高使用温度±3°C 試験電圧: 定格電圧×200%の直流電圧 試験時間: 1000時間 *試験条件は品種ごとに異なります。 詳細は個別の仕様書をご確認ください。
	静電容量変化率	±3.0%または±0.3pFのうち いずれか大きい方の値以下	±12.5%以下	
	Qおよび誘電正接	4%以下		
	絶縁抵抗	1,000MΩまたは50MΩ・μFのいずれか小さい方の値以上		
たわみ	外観	著しい機械的損傷がないこと		熱処理を行う。 たわみ量: 1mm 移動速度: 0.5mm/sec 試験中は 静電容量計を接続する。  単位: mm
	静電容量変化率	±5%または±0.5pFのうちいずれか大きい方の値以下	±12.5%以下	

注1: 品種により性能仕様が異なります。詳細は個別の仕様書をご確認ください。

注3: 熱処理は150+0/-10°Cにて1時間後、室温中に取り出し48±4時間放置する。

注4: 電圧処理は試験条件に規定されている条件にて1時間処理後、室温中に取り出し48±4時間放置する。